

Tagungsprogramm TuZ 2015

Sonntag, 1. März 2015

17:00 - 19:00 Registrierung
Hotel Vier Jahreszeiten, Empfang

18:00 - 22:00 Abendessen, Maultaschenbuffet (incl. Getränke bis 22 Uhr)
Hotel Vier Jahreszeiten, Atrium

20:00 - 22:00 Öffentliche Sitzung der GI/GMM/ITG-Fachgruppe "Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen
Hotel Vier Jahreszeiten, Gorissaal

Montag, 2. März 2015

7:30 - 9:00 Frühstücksbuffet
Hotel Vier Jahreszeiten / Stift Urach

8:00 - 9:00 Registrierung
Stift Urach, Empfang

9:00 - 10:00 Eröffnung und eingeladener Vortrag
Electrical Overstress (EOS) of Semiconductors (SC) in Automotive Applications, Root Causes, and Conclusions
C. Thienel, *Robert Bosch GmbH*
Stift Urach, Seminarsaal Johannes-Brenz

10:00 - 10:30 Kaffeepause
Stift Urach, vor Seminarsaal Johannes-Brenz

10:30 - 12:00 Session 1: Testerzeugung
P. Engelke, *Infineon Technologies AG*
Erzeugung diagnostischer Testmuster unter komplexen Constraints
T. Koal, S. Eggersglüß, M. Schölzel, *BTU Cottbus-Senftenberg, Universität Bremen, IHP Leibnitz-Institut für Innovative Mikroelektronik*

On the Automatic Generation of SBST Test Programs for In-Field Test
A. Riefert, R. Cantoro, M. Sauer, M. S. Reorda, B. Becker, *Albert-Ludwias-Universität Freiburg, Politecnico di Torino*

On the Automated Verification of User-Defined MBIST Algorithms
J. Kinseher, M. Richter, *Intel Mobile Communications Neubiberg*
Stift Urach, Seminarsaal Johannes Brenz

12:00 - 13:30 Mittagessen
Hotel Vier Jahreszeiten, Restaurant

13:30 - 14:15 Eingeladener Vortrag
Electronics in Nano-Era: Are We Facing a Reliability Wall?
S. Hamdioui, *Delft University*
Stift Urach, Seminarsaal Johannes-Brenz

14:15 - 15:45 Session 2: Fehlersimulation und Ausfallanalyse
W. Anheier, *Universität Bremen*
Fehlereffektsimulation mittels virtueller Prototypen
S. Reiter, M. Becker, O. Bringmann, A. Burger, M. Chaari, R. Drechsler, T. Kruse, C. Kuznik, J. Laufenberg, H. Le, P. R. Maier, D. Müller-Gritschneider, H. Post, J.-H. Oetjens, W. Rosenstiel, A. von Schwerin, B.-A. Tabacaru, A. Viehl, *FZI Forschungszentrum Informatik, Universität Paderborn, Universität Tübingen, Infineon Technologies AG, Universität Bremen, Technische Universität München, Robert Bosch GmbH, Siemens AG*

Automation of Failure Propagation Analysis through Metamodeling and Code Generation
M. Chaari, W. Ecker, T. Kruse, B.-A. Tabacaru, *Infineon Technologies AG*

Hochbeschleunigte Simulation von Verzögerungsfehlern unter Prozessvariationen
E. Schneider, M. A. Kochte, H.-J. Wunderlich, *Universität Stuttgart*
Stift Urach, Seminarsaal Johannes-Brenz

15:45 - 16:30 Kaffeepause und Postersession
Systemmodellierung zur Fehlereffektsimulation
A. Burger, S. Reiter, A. Viehl, O. Bringmann, W. Rosenstiel, *FZI Forschungszentrum Informatik, Universität Tübingen*

Analyzing an SET at Gate Level using a Conservative Approach
N. Thole, G. Fey, A. Garcia-Ortiz, *Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Universität Bremen*

Testing Devices requiring Regulation Loops using Standard ATE Instruments
A. Zucchetti, *Advantest Italia S.r.l*

Test von HF-Multiplexern für hohe Spannungen
B. Bieske, M. Meister, D. Kirsten, *Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme gemeinnützige GmbH, X-FAB Semiconductor Foundries AG*

Automatisierte Erstellung von Blackbox Tests am Beispiel von Stromverteilerleisten
W. Kilian, C. Pätz, U. Heinkel, *Techn. Universität Chemnitz*
Stift Urach, Seminarsaal Anna-Magdalena Bach

16:30 - 18:00 Session 3: Testdurchführung
W. Vermeiren, *Fraunhofer IIS/EAS Dresden*
Effiziente Auswahl von Testfrequenzen für den Test kleiner Verzögerungsfehler
S. Hellebrand, T. Indlekofer, M. Kampmann, M. A. Kochte, C. Liu, H.-J. Wunderlich, *Universität Paderborn, Universität Stuttgart*

Die automatische Generierung von Testprogrammen im täglichen Einsatz
R. Baumann, N. Nebel, *Teradyne GmbH, Robert Bosch GmbH*

An Automatic Test Cell Operation to Serve Multiple Users and Products Concurrently
S. Sattler, P. Muhmenthaler, *University Erlangen-Nuremberg, MUHMY Systems*
Stift Urach, Seminarsaal Johannes-Brenz

19:00 - 23:00 Abendveranstaltung (incl. Getränke bis 23 Uhr)
Hotel Vier Jahreszeiten, Höfle und Atrium

Dienstag, 3. März 2015

7:30 - 9:00 Frühstücksbuffet

9:00 - 10:30 Session 4: Test und Zuverlässigkeit analoger Schaltungen

M. Schölzel, *BTU Cottbus-Senftenberg Techn. Informatik*

Ein regelungstechnischer Ansatz zur Testsignalgenerierung für Analogschaltungen

W. Vermeiren, F. Hopsch, R. Jancke

Fraunhofer IIS/EAS Dresden

Evaluierung vs. Test von HF-CMOS-Modulen

B. Bieske, K. Heinrich

Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme gemeinnützige GmbH, X-FAB Semiconductor Foundries AG

Localization of Temperature Sensitive Areas on Analog Circuits

C. Eichenseer, Dr. G. Pöppel, Prof. Dr. T. Mikolajick

Infineon Technologies AG, NaMLab gGmbH, TU Dresden

Stift Urach, Seminarsaal Johannes-Brenz

10:30 - 11:00 Kaffeepause

Stift Urach, vor Seminarsaal Johannes-Brenz

11:00 - 13:00 Session 5: Zuverlässigkeitsbewertung und Fehlertoleranz

W. Hoppe, *Rheinmetall Technical Publications GmbH*

Schnelles Simulationstool für Bonddrahttemperaturen basierend auf inversen Methoden und 3D-konformen Abbildungen

C.-C. Jung, C. Silber, J. Scheible, M. Pfost

Robert Bosch Centre for Power Electronics Reutlingen University, Robert Bosch GmbH

Verbesserter TMR-Strahlungsschutz für ASIC-Layouts

V. Petrovic, G. Schoof, M. Krstic

IHP Frankfurt (Oder)

Neue Methodik zur Implementierung fehlertoleranter pipeline-basierter Architekturen

S. Weidling, M. Krstic, V. Petrovic, M. Gössel

IHP Frankfurt (Oder), Universität Potsdam

Joint Consideration of Performance, Reliability and Fault Tolerance in Regular Networks-on-Chip via Multiple Spatially-Independent Interface Terminals

P. Gorski, T. Wegner, D. Timmermann, University of Rostock

Stift Urach, Seminarsaal Johannes-Brenz

13:00 - 13:15 Schlusswort

Stift Urach, Seminarsaal Johannes-Brenz

13:15 - 14:15 Mittagessen

Hotel Vier Jahreszeiten, Restaurant

14:30 - 15:30 Stadtführung

Bad Urach

Veranstaltungsorte



27. GI/GMM/ITG – Workshop

Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen

TuZ 2015

1. - 3. März 2015

Stift Urach und Flair Hotel Vier Jahreszeiten
Bad Urach